PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

.....

62-199795

(43)Date of publication of application: 03.09.1987

(51)Int.CI.

C25D 7/00 C25D 5/10 H01B 5/02 H01L 23/48 H01R 13/63 H05K 3/34

(21)Application number : 61-040299

(71)Applicant : NIPPON MINING CO LTD

(22)Date of filing:

27.02.1986

(72)Inventor: ARAKIDA YASUHIRO

FUKAMACHI KAZUHIKO

(54) PARTS FOR ELECTRONIC AND ELECTRICAL APPLIANCES.

(57) Abstract.

PURPOSE: To obtain parts for electronic and electrical appliances having superior heat resistance by forming a Co-Ni alloy layer as an underlayer on a metallic plate by striking and a noble metallic layer on the underlayer by plating.

CONSTITUTION: When a metallic plate is plated with a noble metal, a Co-Ni alloy layer consisting of >60wt% Co and the balance Ni is formed as an underlayer by striking and an Au or Au alloy layer is formed on the underlayer by plating, in case where an Ag or Ag alloy is formed by plating, a Co-Ni alloy layer consisting of 22wt% Co and the balance Ni is formed as an underlayer by striking.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

(Date of sending the examiner's decision of rejection)

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

(Date of final disposal for application)

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C), 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 199795

⑤Int.Cl.⁴	識別記号	庁内整理番号		43公開	昭和62年(1987	7)9月3日
C 25 D 7/00 5/10		H-7325-4K 7325-4K					
H 01 B 5/02 H 01 L 23/48 H 01 R 13/03		A - 7227 - 5E 7735 - 5F D - 8623 - 5E					
H 05 K 3/34		H-6736-5F	審査請求	未請求	発明の数	1	(全5頁)

母発明の名称 電子・電気機器用部品

②特 願 昭61-40299

突出 願 昭61(1986)2月27日

⑫発 明 者 荒 木 田 泰 弘 神奈川県高座郡寒川町倉見3番地 日本鉱業株式会社倉見 工場内

⑫発 明 者 深 町 一 彦 神奈川県高座郡寒川町倉見3番地 日本鉱業株式会社倉見

工場内

①出 願 人 日本鉱業株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号

邓代 理 人 弁理士 並川 啓志

明 細 普

1. 発明の名称

電子・電気機器用部品

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 金属板上に、貴金属めっきの下地としてコバルトーニッケル合金ストライクめっき層と、さらにその上に貴金属めっき層を備えた電子・電気機器用部品。
- (2)金属板上に、貴金属めっきの下地としてコバルト60wt%を超え、残部がニッケルからなるコバルトーニッケル合金めっき層と、さらにその上に金又は金合金めっき層を備えた特許請求範囲の第1項に記載された電子・電気機器用部品。
- (3) 金属板上に、貫金属めっきの下地としてコバルト2 w t %以上、残部がニッケルからなるコバルトーニッケル合金めっき間と、さらにその上に銀又は銀合金めっき間を備えた特許請求範囲の第1項に記載された電子・電気機器用部品。
- 3. 発明の詳細な説明

(目 的)

本発明は、金属板上に A u 、 A g 等の貴金属めっきを施したリードフレームあるいは端子コネクター等の電子・電気機器用部品に関するものである。

(從來技術)

Au、Ag等の貴金属は化学的及び物理的性質に優れているので、各種の電子・電気部品にであるためであるためであるためである。とが望まれているを薄くすることが望まれているとが望まれているといる子・電気部品としての貴金属のようなないは高温を受ける場合があるが、このはは高温を受ける下地金属の酸化より半田付性、ボンク性等が著しく劣化したり変色してしまう次点があった。

このため上記のような高温環境下における品質の低下を防ぐ目的のために、貴金属めっきを施す前の下地めっきとして、Sn-Ni、Sn-Co、Pd-Ni及びNi等を施すことが試みられてい

るが、これらの下地めっきを施したものでも45 ○℃の大気中に3分間保持すると、貴金属めっき 層が例えば、Au〇・1μあるいはAg〇・5μ程 度の薄いめっき厚では十分な半田付性及びポンシー では十分な半田付性及びポンキー ではっき層を数μ程度の厚いめっきを施さなければならないという欠点の った。このように従来の下地めっきをり損失を受けていた。

(權 成)

本発明はかかる現状に鑑み鋭意研究を行った結果成されたものであり、貴金属めっき層がAu0。 1 μあるいはAg0。5 μ程度の薄いめっき厚において、450℃の大気中に3分間保持した後でも十分な半田付性及びボンディング性を示す貴金属のき材を提供するものである。すなわち本発明は金属板上に、貴金属めっきの下地として、さらにその上に貴金属めっき層を備えた電子・電気機

下としたのは、300g/1を超えると析出物が 粒状となる傾向が認められると共に、液の粘性が 増し、汲出し量が多くなり不経済であるからであ る。塩酸の濃度を300g/l以上としたのは、 300g/ 1未額では活性化の効果が十分ではな いからであり、又、300g/L以下としのは、 300g/lを超えても性能の向上が認められな いからである。更に必要に応じて界面活性剤が添 加されるが、陰イオン性の界面活性剤としてはポ リオキシエチレンアルコールエーテル、ポリオキ シエチレンアルキルフェノールエーテル等が適当 であり、非イオン性の界面活性剤としてはポリエ チレングリコールアルコールエーテル、ポリエチ レングリコールアルキルフェノール、ポリエチレ ングリコール脂肪酸等が適当である。これらの界 面活性剤は1種又は2種以上組合せて使用するこ とができるが、使用濃度は30g/L以下、好ま しくは10g/L以下とする。又、めっき条件に ついては浴温を5~50℃、好ましくは10~ 40°、電流密度を0.1~20A/d mf、好ま

器用部品並びに金属板上に、貴金属めっきの下地としてコパルト60wt%を超え、残部がニッケルからなるコバルトーニッケル合金めっき層と、さらにその上に金又は金合金めっき層を備えた前配電子・電気機器用部品及び金属板上に、貴金属めっきの下地としてコバルト2wt%以上、残部がニッケルからなるコバルトーニッケル合金めっき層と、さらにその上に銀又は銀合金めっき層を備えた前記電子・電気機器用部品に関するものである。

(発明の具体的説明)

本発明中のコバルトーニッケル合金ストライクめっき被には塩化ニッケル10g/ & ~300g / & 及び塩酸30g / & ~300g / & 及び塩酸30g / & ~300g / & 及び塩を30g / & ~300g / & の被組成のものを用いる。以上のように塩化ニッケル及び塩化コバルトの濃度を5g / & 以上としたのは、5g / & 朱満では金属イオンの濃度が低く緻密なめっき皮膜を得ることができないからであり、又、300g / & 以

しくは1~15A/d㎡とし、攪拌を行ってもよく又静止状態でも実施できる。陽極としては好ましくはニッケル、コバルト及びコバルトーニッケル合金を用いるが、ステンレス等の不溶性の金属を使用することができる。コバルトーニッケル合金ストライクめっき層の厚みは0・1μ未満が望ましく、好ましくは500A以下である。このように規定したのはコバルトーニッケル合金ストライクめっき層の厚みが0・1μ以上では世金属層の群性(加熱後の半田付性及びボンディング性)が著しく劣化するからである。

母材の金属としては下e、下e合金、Cu、Cu合金及びセラミックのメタライズ材等が使用される。なお本発明においては、本発明の下地めっきの前にさらに他の下地めっきを施すことはもちろん可能であって、本発明はこれらを当然包含するものである。

以下、本発明を実施例に基づき説明する。 (実 施 例)

ステンレス (SUS430、0.11mmt) 及

びりん背銅(〇・2〇 mm t)を公知の方法で脱脂、酸洗処理を施した後、以下の工程に基づいて貴金属めっきを施した。めっきした後、450℃の大気中で加熱処理(〇・6〇、18〇秒)を施し、半田付性及びボンディング性を評価した。

(本発明例)

- (1) ニッケルーコバルト合金ストライクめっき① 0.02 µ(母材 ステンレス)
 - → 金めっき 0.1 µ
 - → 銀めっき 0.5μ
- (2) ニッケルーコバルト合金ストライクめっき② 0.02 μ(母材 りん青銅)
 - → 金めっき 0.1μ
 - → 銀めっき 0.5 µ

(此 較 例)

- (3) ニッケルストライクめっき $0.02\,\mu$ → ニッケルーコ (伊材 ステンレス) バルト合金めっき $0.1\,\mu$ 、 $0.5\,\mu$ → 金めっき $0.1\,\mu$
- (4) ニッケルーすず合金めっき 0.1μ 、 0.5μ (母材 りん背剝)
 - → **金めっき 0.1** μ
 - → 鍛めっき 0.5μ
- (5) ニッケルストライクめっき 0.02 µ → パラジウムニ (母材 ステンレス)

塩化ニッケル 200g/0

i 酸 150g/2

ポリオキシエチレンラウリル

アルコールエーテル 2g/ 0

温 度 20℃

電流密度 1A/dm²

・ニッケルーコパルト合金下地めっき

(Ni30vt%, Co70vt%)

→ 銀めっき 0.5μ

浴組成 硫酸ニッケル 13g/6

硫酸コバルト 115g/2

ほう酸 25g/l

塩 化 カ リ 15g/ 6

温 度 10℃

電流密度 1A/dm²

・ニッケルストライクめっき

浴組成 塩化ニッケル 250g/Q

塩 酸 100g/Q

温 度 20℃

電流密度 5A/dm²

· <u>ニッケル-すず合金下地めっき</u>

ッケル合金めっき 0.1μ 、 0.5μ \rightarrow 金めっき 0.1μ

→ 銀めっき 0.5 μ

- (6) ニッケルーコバルト合金ストライクめっき① 0.005 μ(母材 ステンレス)
 - → 金めっき 0.1 µ
 - → 銀めっき 0.5_µ
- (7) ニッケルーコバルト合金ストライクめっき② 0.2 μ(母材 ステンレス)
 - → 金めっき 0.1 µ
 - → 銀めっき 0.5 μ

評価結果を第1数に示す。又、めっき条件及び 評価方法については以下に示す。

・<u>ニッケルーコパルト合金ストライクめっき①条</u>

(NilOvt%, Co9Ovt%)

浴組成 塩化コバルト 100g/l

塩化ニッケル 150g/1

塩 酸 100g/ℓ

温 度 20℃

電流密度 5A/dm²

· <u>ニッケルーコパルト合金ストライクめっき</u>②条

件

生

(Ni25vt%, Co75vt%)

浴組成 塩化コバルト

50 g / 2

(Ni33ut%, Sn67ut%)

浴組成 塩化第1すず 50g/2

塩 化 ニ ッ ケ ル 300 g/ L

フッ化ナトリウム 28g/2

酸性フッ化アンモニウム

35 g / 2

温 度 65℃

電流密度 0.5A/dm²

・パラジウムーニッケル合金下地めっき

(Pd80vt%, Ni20vt%)

日進化成機製 PNP-80EL (商品名)

温 度 30℃

電流密度 1.0A/dm²

・金めっき

田中貴金鳳製 テンペレックス 701 (商品名)

温 度 50℃

・鍛めっき

田中貴金属製 SILVLEX JS-1 (商品名)

温 度 20℃

· <u>半田付性試験方法</u>

サンプルを25%ロジンメタノール5秒浸漬後 240±5℃に保持された 60/40 (Sn/Pb) 半田 浴中に5秒浸漬し、ヌレ曲線を得た。得られたヌ レ曲線よりT2(浮力がOになるまでの時間:短い 程溫れ性良好)をもとめ半田付性を評価した。又、 外観状況も観察した。 (n=5)

・ボンディング性試験方法

サンプル上に 2 5 μ φ の 金線 を 1 ㎜ の間隔でボ ールーウェッジボンドを施し、その引っ張り強度 によりボンディング性を評価した。 (n = 20)

以下余白

第1 表 半田付性及びポンディング性評価結果

	T			熟処理	金 めっき材 銀 めっき材					
	Na	母材の種類	下地めっき	時間		付 性*	ボンディング性*	半 田	付性	ポンディング性
	<u> </u>			(秒)	T ₂ (秒)		引っ張り強度(g)	T2 (秒)	_外积状况	引っ張り強度(g)
			ニッケルーコバルト	0	0.14	0	7.6	0.33	0	7.5
本発	(1)	ステンレス	合金ストライクの	60	0.23	.0	7.0	0.33	Q	7.1
9E	-			180	0.53	Q	7.3	0.41	<u> </u>	7.9
明例	(2)	リン青銅	ニッケルーコバルト	0	0.15	Ŏ	7.6	0.34	0	7.6
D'3	(2)	9219	合金ストライク②	60 180	0.24	00	7.2 7.4	0.38	00	7.3 7.4
	 		ニッケルストライク	180	0.80	- 6	8.0	0.65	00	7.4
	(3)	ステンレス	→ニッケルーコバルト	60	0.60	Ö	7.6	0.75)0	7.7
			合金 0.1μ	180	3.54		7.8	0.28	×	7.5
			ニッケルストライク	0	0.73	<u> </u>	7.9	0.73	0	7.9
	(3)	ステンレス	→ニッケルーコバルト	60	0.69	0	7.3	0.69	0	8.0
比			合金 0.5μ	180		×	4.4	_	×	7.9
	1,00		ニッケルストライク	0	0.52	Ō	7.6	0.41	Ö	7.5
	(4)	リン青銅	→ニッケルーすず合金	60	2.38	0	7.6	0.94	0	7.6
			0.1 µ	180		×			X	7.7
	(4)	リン背銅	ニッケルストライク →ニッケルーすず合金	0 60	0.54	0	7.8	0.53	00	7.7
較	(4)	72 A RE	0.5 μ	180	2.22	O ×	8.1	1.21	O X	7.2 7.5
424			ニッケルストライク	100	0.26	ô	8.1	0.28	ô	7.7
	(5)	ステンレス		60	0.89	ŏ	8.2	0.32	ŏ	7.9
			0.1 μ	180	_	×	_	0.32	Δ	8.1
			ニッケルストライク	0	0.28	0	7.7	0.28	0	8.2
	(5)	ステンレス	→P d - N i 合金	60	0.84	0	8.5	0.32	0	7.8
			0.5μ	180		×	_	0.30	Δ	7.4
67	(6)		ニッケルーコバルト	0	0.67	0	7.4	0.63	0	7.9
	(6)	ステンレス	合金ストライク①	60	0.74	0	7.6	0.74	Ò	7.6
	 		0.005 µ ニッケルーコバルト	180	-	×	7.3	0.32	Δ	7.4
	(7)	ステンレス	合金ストライク②	6 0	0.68	00	8.1 7.8	0.65 0.72	00	7.9 8.0
	`''	~,	0.24	180	0.72	×	5.1	0.28	×	7.2

第1表に示すように本発明例では比較例に比べ 半田付性及びボンディング性に優れている。

特に半田付性においては180秒の加熱処理を した後でも、比較例の加熱処理をしないものと同 程度の性質を示し、加熱処理後においても半田付 性に著しく優れていることが分かる。

(効果)

このように本発明の電子・電気機器用部品及び その製造方法は熱による劣化が少なく(耐熱性が すぐれ)又、貴金属めっきの薄肉化が可能であり かつ製造コストが安い工業上優れた効果を奏する ものである。

特許出願人 日本鉱業株式会社代 理 人 弁理士(7569)並川啓志